九州大学マテリアル先端リサーチインフラ事業に関する規程

令和３年度九大規程第１１１号
制　　定：令和　４年　３月３１日
最終改正：令和　６年　９月１９日
（令和６年度九大規程第２６号）

（趣旨）

第１条　この規程は、九州大学マテリアル先端リサーチインフラ事業（文部科学省の委託事業「マテリアル先端リサーチインフラ」により九州大学（以下「本学」という。）が実施機関として行う事業をいう。以下「本事業」という。）に関して必要な事項を定めるものとする。

（業務主任者）

第２条　本事業の業務主任者を置き、本学の教員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

（事業の構成）

第３条　本事業を実施するために解析部門、合成部門及びデータ部門を設置する。

２　前項の各部門に担当責任者を置き、業務主任者が任命する者をもって充てる。

（共用設備）

第４条　解析部門及び合成部門にそれぞれ別表１のとおり共用設備を置き、学内及び学外の利用（本学の職員が技術補助を行う場合及び測定等を代行する場合を含む。以下同じ。）に供するものとする。

２　共用設備にそれぞれ設備管理者を置き、当該設備が設置されている部局等の教員のうちから担当責任者が指名する者をもって充てる。

３　別表１の解析部門に九州大学シンクロトロン光利用研究センタービームライン等利用規程（平成２３年九大規程第６８号。以下「ビームライン規程」という。）に定めるビームライン及び分析付帯装置（以下「ビームライン等」という。）を置き、ビームライン規程に定めるところにより、これを学内及び学外の利用に供するものとする。

（分子・物質合成支援）

第５条　合成部門の共用設備の利用者のうち、自ら試料の作成、合成等を行うことが困難なものについては、本学の職員が代行して分子・物質合成の支援を行うものとする。

（データ利活用支援）

第６条　データ部門に、共用設備で生成されたデータの蓄積及び利活用を目的としてデータサーバを設置する。

２　データサーバには設備管理者を置き、データ部門の担当責任者が指名する者をもって充てる。

（利用の手続）

第７条　解析部門及び合成部門における共用設備を利用しようとする者は、同部門の担当責任者に申請し、その承認を受けなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、ビームライン等を利用しようとする者は、ビームライン規程に基づき申請し、その許可を得なければならない。

（利用料等）

第８条　解析部門及び合成部門における共用設備の利用料は別表１のとおりとし、分子・物質合成支援の利用料は別表２のとおりとする。

２　前条の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、別表１又は別表２に掲げる利用料を、所定の期日までに、経費の振替又は本学が指定する口座への振込みにより支払わなければならない。

３　前項の規定にかかわらず、総長が特に認める場合は、利用料の全部又は一部を免除することができる。

４　既納の利用料は、原則として返還しない。

５　第１項の規定にかかわらず、ビームライン等を利用する者は、ビームライン規程に基づき利用料等を支払わなければならない。

（利用の条件）

第９条　利用者は、設備管理者の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって共用設備を利用しなけれ

ばならない。

（免責）

第１０条　利用者が受ける損害のうち、次の各号のいずれかに該当する場合には、本学は、その責めを負わない。

(1)　天変地異等のやむを得ない事由により共用設備の利用ができず、損害が生じたとき。

(2)　利用者の責めに帰すべき事由によって損害が生じたとき。

（損害賠償）

第１１条　利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用に係る共用設備、備品等を滅失、破損又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

（事務）

第１２条　本事業に関する事務は、学内関係各課等の協力を得て、工学部等事務部において処理する。

（雑則）

第１３条　この規程に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、業務主任者が別に定める。

附　則

この規程は、令和４年４月１日から施行する。

附　則（令和４年度九大規程第１３号）

この規程は、令和４年７月１日から施行する。

附　則（令和４年度九大規程第３１号）

この規程は、令和４年１０月１日から施行する。

附　則（令和４年度九大規程第４０号）

この規程は、令和５年１月１６日から施行する。

附　則（令和４年度九大規程第７６号）

この規程は、令和５年４月１日から施行する。

附　則（令和５年度九大規程第２６号）

この規程は、令和５年９月１日から施行する。

附　則（令和５年度九大規程第７８号）

この規程は、令和６年４月１日から施行する。

附　則（令和６年度九大規程第２０号）

この規程は、令和６年８月１日から施行する。

附　則（令和６年度九大規程第２６号）

この規程は、令和６年１０月１日から施行する。

別表１（第４条、第８条関係）

1. 解析部門

（1） 利用1枠当たりの利用料を設定する設備

共　用　設　備　名	利用料（※1）（※2）	
	データ（※3）を本事業に利用することに同意する場合	データを本事業に利用することに同意しない場合
超高圧電子顕微鏡（JEM－1300NEF）	17，000円	21，000円
収差補正走査／透過電子顕微鏡（JEM－ARM200F）	16，000円	19，000円
マイクロカロリメータSEM （マイクロカロリメータ高エネルギー分解能元素分析装置） （TES+ULTRA55）（※4）	8，400円	9，900円
デュアルビームFIB（Quanta 3D 200i）	14，000円	16，000円
広電圧超高感度原子分解能電子顕微鏡（JEM-ARM200CF）	17，000円	20，000円
収差補正高分解能電子顕微鏡（JEM－ARM200F）	18，000円	21，000円
ハイコントラスト補助電子顕微鏡（JEM－2100HCKM）	6，700円	7，900円
三次元透過電子顕微鏡（Titan）	31，000円	37，000円
三次元走査電子顕微鏡（Scios）	20，000円	23，000円
デュアルビーム微細加工電子顕微鏡（Versa3D）	19，000円	22，000円
キセノンプラズマ集束イオンビーム加工・走査電子顕微鏡複合機（Helios）	71，000円	87，000円
新高分解能電子顕微鏡（JEM-ARM300F2）	75，000円	89，000円
汎用電子顕微鏡（JEM－2100F）	9，900円	12，000円
研磨・薄片化装置（※5）（※6） ・PIPS Ⅱ M-695 ・Nano MILL Model 1040 ・イオンスライサー EM-09100IS	1，200円	1，400円
電子顕微鏡用隔膜型ガス雰囲気試料ホルダー（※8）（※9）	5，500円	6，500円
クロスセクションポリッシャ（IB-19530CP）	2，700円	3，200円
グローブボックス（UN-1000L-AGI）	7，600円	9，000円

雰囲気遮断加熱・冷却試料ホルダー（※11）	1，600円	1，800円

共用設備名	利用料（※1）		
	利用1枠の区分	データを本事業に利用することに同意する場合	データを本事業に利用することに同意しない場合
直交型 FIB-SEM（MI4000L）	10:00～14:00	20，000円	24，000円
	14:30～18:30		
	19:00～23:00（※7）		
	23:00～翌 9:00（※7）	50，000円	60，000円
イオンビーム・電子ビーム複合型精密加工分析装置（Helios5UX）（※10）	10:00～14:00	27，000円	33，000円
	14:30～18:30		
	19:00～23:00（※7）		
	23:00～翌 9:00（※7）	66，000円	81，000円

（2） 利用1件当たりの利用料を設定する設備

共用設備名	利用料	
	データを本事業に利用することに同意する場合	データを本事業に利用することに同意しない場合
コーティング装置 （※5）（※6） ・イオンコーター JFC-1600 ・カーボンコーター EC 32010CC	560円	660円

備考

（※1） 本学の職員が技術補助を行う場合において、次に掲げるときは、それぞれ次に定める額を利用料に加算する。

① 本学の職員が操作の補助及び操作方法の指導を行いながら、利用者自身が機器を操作するとき 1枠当たり5，100円

② 利用者の指示を受け、本学の職員が機器を操作するとき 1枠当たり11，000円

（※2） 1枠は下記の区分の4時間とする。

10:00～14:00／14:30～18:30

（※3） 共用設備で生成されたデータ及びその利活用のために設備等を利用する者から必要に応じて提供される補足的データをいう（以下同じ）。

（※4） 本機器利用の際、液体ヘリウムを使用する場合は、実費徴収とする。

（※5） 各設備使用ごとに利用料を徴収する。

（※6） 装置の割当てについては使用状況等に応じて本学が決定するものとする。

（※7） 特殊な実験で、夜間に装置を自動運転で稼働させ続ける場合のみ対象となり、同日の 14:30～18:30 の枠からの継続利用を条件とする。

（※8） 本機器使用に係るMEMSチップ、特殊なガス（窒素、アルゴン、酸素及び水素を除く。）及び未使用のキャピラリーは含まない。

（※9） 本機器使用の際、MEMSチップを使用する場合は、実費徴収とし、未使用のキャピラリーは、使用者が持参し、当該費用は使用者の自己負担とする。

（※10） 本機器使用の際、冷却加工のため窒素ガスを使用する場合は、実費徴収とする。

（※11） 本機器使用の際、Heating chips を使用する場合は、実費徴収とする。

2. 合成部門

（1） 1時間当たりの利用料を設定する設備

共　用　設　備　名	利用料	
	データ（※1）を本事業に利用することに同意する場合	データを本事業に利用することに同意しない場合
電子状態測定システム（AXIS-ULTRA）	3，000円	3，600円
表面・界面分子振動解析装置（Spectra-Physics）	1，600円	1，900円
高速レーザーラマン顕微鏡（RAMANtouch）	2，200円	2，600円
紫外可視近赤外分光測定装置（V-670）	1，700円	2，000円
UV－Vis－NIR分光光度計（SolidSpec-3700DUV）（※2）	680円	800円
中赤外・遠赤外吸収測定装置（Spectrum400 FT-IR/FIR SpotLight400 IR イメージング）	750円	890円
超高速 HPLC 分離・分子構造分析システム	2，100円	2，500円
分取HPLCシステム（LC-908-C60）	4，700円	5，600円
近赤外蛍光分光装置（NanoLOG-EXT）	1，200円	1，400円
核磁気共鳴吸収装置（AVANCE NEO 400）	3，500円	4，100円
MALDI－TOF　MS 質量分析装置（Autoflex max）	2，600円	3，000円
分離用小型超遠心機（CS100GXL）	360円	430円
走査型プローブ顕微鏡（SPM－9600）	1，300円	1，500円
環境制御型多機能走査プローブ顕微鏡（SPI3800N）	420円	500円
超高分解能走査電子顕微鏡（SU9000）	1，700円	2，000円
3次元SEM画像測定解析システム（VE-8800）	1，200円	1，500円
透過型電子顕微鏡システム（JEM-2010）	980円	1，200円
ウルトラミクロトーム（EM UC7）	1，700円	2，000円
マイクロ構造観察電子顕微鏡システム（JASM-6200）	3，300円	3，900円
ゼータ電位／粒径測定システム（ELSZ-2）	1，300円	1，500円

全自動水平型多目的X線回折装置(SmartLab)	2，500円	3，000円
単結晶 X 線解析装置(MicroMax-007HF)	950円	1，200円
小角 X 線散乱装置(NANO-Viewer KMYC)	1，100円	1，300円
分子構造解析システム	360円	420円
ナノ炭素燃料電池評価システム	390円	470円
触媒活性表面積測定システム	440円	520円
ガス吸着装置(BELSORP-max-12-SP)	450円	530円
CCD マルチ ICP 発光分光分析装置(ARCOS EOP 130)	3，100円	3，600円
マイクロカロリメーター (PEAQ-ITC)	2，400円	2，800円

(2) 次の設備を利用する測定等の代行を依頼する場合

共　用　設　備　名	利用料(1時間当たり)	
	データを本事業に利用することに同意する場合	データを本事業に利用することに同意しない場合
電子状態測定システム(AXIS-ULTRA)	6，500円	7，700円
表面・界面分子振動解析装置(Spectra-Physics)	5，100円	6，000円
高速レーザーラマン顕微鏡(RAMANtouch)	5，500円	6，400円
紫外可視近赤外分光測定装置(V-670)	5，000円	5，800円
UV－Vis－NIR分光光度計(SolidSpec-3700DUV)(※2)	4，000円	4，700円
中赤外・遠赤外吸収測定装置(Spectrum400 FT-IR/FIR SpotLight400 IR イメージング)	4，200円	5，000円
超高速 HPLC 分離・分子構造分析システム	5，400円	6，400円
分取HPLCシステム(LC-908-C60)	8，000円	9，500円
近赤外蛍光分光装置(NanoLOG-EXT)	4，400円	5，200円
核磁気共鳴吸収装置(AVANCE NEO 400)	6，400円	7，500円
MALDI－TOF MS 質量分析装置(Autoflex max)	5，400円	6，400円

分離用小型超遠心機（CS100GXL）	3，700円	4，300円
走査型プローブ顕微鏡（SPM－9600）	4，600円	5，400円
環境制御型多機能走査プローブ顕微鏡（SPI3800N）	3，900円	4，600円
超高分解能走査電子顕微鏡（SU9000）	5，000円	5，900円
3次元SEM画像測定解析システム（VE-8800）	4，500円	5，300円
透過型電子顕微鏡システム（JEM-2010）	4，300円	5，100円
ウルトラミクロトーム（EM UC7）	4，700円	5，500円
マイクロ構造観察電子顕微鏡システム（JASM-6200）	6，700円	7，900円
ゼータ電位／粒径測定システム（ELSZ-2）	4，500円	5，300円
全自動水平型多目的X線回折装置（SmartLab）	5，800円	6，900円
単結晶 X 線解析装置（MicroMax-007HF）	3，900円	4，600円
小角 X 線散乱装置（NANO-Viewer KMYC）	4，000円	4，700円
分子構造解析システム	3，700円	4，300円
ナノ炭素燃料電池評価システム	3，900円	4，600円
触媒活性表面積測定システム	3，900円	4，600円
ガス吸着装置（BELSORP-max-12-SP）	4，900円	5，800円
CCD マルチ ICP 発光分光分析装置（ARCOS EOP 130）	5，600円	6，600円
マイクロカロリメーター　（PEAQ-ITC）	5，200円	6，100円

備考

（※1）　共用設備で生成されたデータ及びその利活用のために設備等を利用する者から必要に応じて提供される補足的データをいう（以下同じ）。

（※2）　本機器利用の際、窒素ガスを使用する場合は、実費徴収とする。

別表２（第５条、第８条関係）

支　援　名	利用料（1時間当たり）	
	データ（※）を本事業に利用することに同意する場合	データを本事業に利用することに同意しない場合
分子・物質合成支援	1，600円	1，900円

備考

（※）　共用設備で生成されたデータ及びその利活用のために設備等を利用する者から必要に応じて提供される補足的データをいう（以下同じ）。